**サポートベクタ―マシンを用いた電極材料の欠陥検出における**

**最適なパラメータの検討**

永田研究室　F114037　樋口昂平

**1.　目的**

　工業製品の品質に対する要求が社会的に高まっている中、工場の生産ラインでは品質管理に関する多くの課題を抱えており、品質改善のための様々な手法が検討されている。その一つとして，コンピュータを活用した欠陥検出が従来から研究されており、レーザやカメラなどの外観検査装置や主成分分析などといった手法をうまく応用することで不良品の判別がされてきた。本研究では人間の視覚システムが行う作業をAIに応用し、製造ラインなどで発生する多種多様な欠陥をより高い認識率で不良品と検出するための基本システムの設計を試み、簡単な識別検査を行うことでシステムの基本性能を評価する。

**2.　研究内容**

**3.　結果**